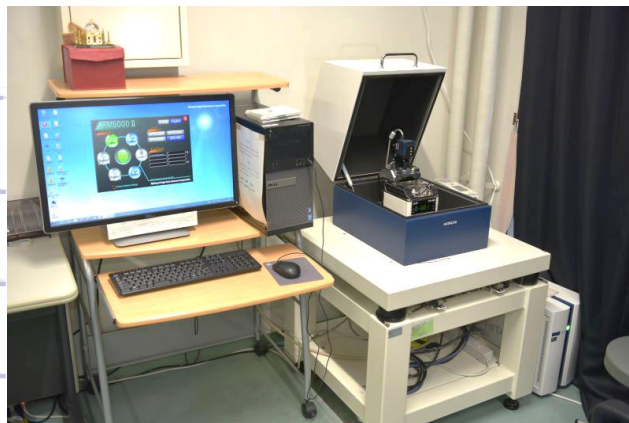


ご利用の装置と登録必須ファイル

Device in use and required registration files

装置名 Device registration name	大気中原子間力顕微鏡 AFM
装置ID Local ID	Jl-012
大分類 Major category	走査型顕微鏡 Scanning Microscope
メーカー名 Manufacturer name	日立ハイテクサイエンス Hitach High-Tech Science
型番 Model number	AFM5000II SPA-400



登録必須ファイル Required registration files

運用版 (Deployed Version)

.xqdx ファイル (画像ファイル/測定条件)
.xqdx file (Image File/Measurement Conditions)

異常終了と表示されたら
If "Abnormal termination" is displayed



登録必須ファイルであるか確認してください。

Please confirm whether it is a required registration file

それでも解消されない場合は、DICEお問い合わせフォームより問い合わせください。

If the issue persists, please contact us through the DICE Inquiry Form

機器利用の際のお約束について

Terms of use for equipment

1 成果を論文やプレスリリースで発表する場合は**謝辞**をご記載ください。

When you publish results in a paper or press release, please include acknowledgments

2 課題利用が終わったら**利用報告書**をご提出ください。

Please submit a user report after completing your project

詳細は以下からご確認ください

For more details, please check below

謝辞について

About acknowledgments

<https://nanonet.go.jp/page/page000731.html>

利用報告書について

About user report

<https://nanonet.go.jp/page/page000846.html>

